

04P00098

1/3

特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し (注意: 電子データが原本となります)

0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号	
0-2	国際出願日	
0-3	(受付印)	
0-4	様式-PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく国際出願願書は、	
0-4-1	右記によって作成された。	JPO-PAS 0322
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受理官庁	日本国特許庁 (RO/JP)
0-7	出願人又は代理人の書類記号	04P00098
I	発明の名称	半導体検査方法及びそのシステム
II	出願人	
II-1	この欄に記載した者は	出願人である (applicant only)
II-2	右の指定国についての出願人である。	米国を除く全ての指定国 (all designated States except US)
II-4ja	名称	エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社
II-4en	Name:	SII NANOTECHNOLOGY INC.
II-5ja	あて名	2618507 日本国
II-5en	Address:	千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 8 番地 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi Chiba 2618507 Japan
II-6	国籍(国名)	日本国 JP
II-7	住所(国名)	日本国 JP
II-8	電話番号	043-211-1150
II-9	ファクシミリ番号	043-211-8020
II-11	出願人登録番号	503460323

特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

III-1	その他の出願人又は発明者	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only) 小川 貴志 OGAWA, Takashi 2618507 日本国 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社内 c/o SII NANOTECHNOLOGY INC., 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi Chiba 2618507 Japan 日本国 JP 日本国 JP	
III-1-1	この欄に記載した者は		
III-1-2	右の指定国についての出願人である。		
III-1-4ja	氏名(姓名)		
III-1-4en	Name (LAST, First):		
III-1-5ja	あて名		
III-1-5en	Address:		
III-1-6	国籍(国名)		
III-1-7	住所(国名)		
IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名下記の者は国際機関において右記のごとく出願人のために行動する。		代理人 (agent) 松下 義治 MATSUSHITA, Yoshiharu 1500012 日本国 東京都渋谷区広尾1丁目11番2号 AIOS広尾ビル807号 AIOS Hiroo Building 807, 11-2 Hiroo 1-chome, Shibuya-ku Tokyo 1500012 Japan 03-3440-8651 03-5475-5947 100079212
IV-1-1ja	氏名(姓名)		
IV-1-1en	Name (LAST, First):		
IV-1-2ja	あて名		
IV-1-2en	Address:		
IV-1-3	電話番号		
IV-1-4	ファクシミリ番号		
IV-1-6	代理人登録番号		
V	国の指定		
V-1	この願書を用いてされた国際出願は、規則4.9(a)に基づき、国際出願の時点で拘束される全てのPCT締約国を指定し、取得しうるあらゆる種類の保護を求め、及び該当する場合には広域と国内特許の両方を求める国際出願となる。		
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主張	2004年 02月 25日 (25. 02. 2004) 2004-050296 日本国 JP	
VI-1-1	出願日		
VI-1-2	出願番号		
VI-1-3	国名		
VI-2	優先権証明書送付の請求 上記の先の出願のうち、右記の番号のものについては、出願書類の認証謄本を作成し国際事務局へ送付することを、受理官庁に対して請求している。	VI-1	
VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)	

特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

VIII	申立て	申立て数	
VIII-1	発明者の特定に関する申立て	—	
VIII-2	出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て	—	
VIII-3	先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て	—	
VIII-4	発明者である旨の申立て(米国を指定国とする場合)	—	
VIII-5	不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て	—	
IX	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
IX-1	願書(申立てを含む)	3	✓
IX-2	明細書	9	✓
IX-3	請求の範囲	2	✓
IX-4	要約	1	✓
IX-5	図面	5	✓
IX-7	合計	20	
	添付書類	添付	添付された電子データ
IX-8	手数料計算用紙	—	✓
IX-17	PCT-SAFE 電子出願	—	—
IX-19	要約書とともに提示する図の番号	1	
IX-20	国際出願の使用言語名	日本語	
X-1	出願人、代理人又は代表者の記名押印	/100079212/	
X-1-1	氏名(姓名)	松下 義治	
X-1-2	署名者の氏名		
X-1-3	権限		

受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書類の実際の受理の日	
10-2	図面	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であってその後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日	
10-5	出願人により特定された国際調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国際調査機関に調査用写しを送付していない	

国際事務局記入欄

11-1	記録原本の受理の日	
------	-----------	--